

ОСОБЕННОСТИ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ АЛЮМИНИЯ В ГЕЛИЕВОЙ ОБЛАСТИ ТЕМПЕРАТУР

Ю.Н.Цзян, В.В.Еременко

До сих пор остается неясным [1], почему степенная зависимость T^5 , полученная из весьма упрощенных теоретических представлений, хорошо согласуется с экспериментальными результатами исследования температурной зависимости электросопротивления немагнитных непереходных металлов. Вполне возможно, что это связано с недостаточной точностью измерения электропроводности, особенно в области низких температур, где, собственно, и можно ожидать отклонения от закона T^5 , так как роль различных механизмов рассеяния электронов становится сравнимой.

Для алюминия на основании экспериментальных данных [2] была предложена эмпирическая зависимость [3] в виде суперпозиции вкладов электрон-электронного и электрон-фононного рассеяния:

$$\delta_{\infty}(T) = (1,98 \cdot 10^{-2} \left[\frac{1}{\text{зпд}} \right] T^2 + 4,34 \cdot 10^{-6} \left[\frac{1}{\text{зпд}} \right] T^5) \cdot 10^{-5}. \quad (I)$$

Индекс ∞ означает, что выражение (I) получено по данным для массивных образцов. Эта зависимость представляется разумной, так как в гелиевой области температур она дает величину вклада электрон-электронного взаимодействия в электросопротивление ($\sim 10\%$), не сильно противоречащую оценкам, проведенным по данным об инфракрас-

ном поглощении [4]. Если выражение (I) справедливо, то при гелиевой температуре $\delta_{4,2}$ отличается от δ_0 на величину 10^{-6} ($\delta_T = R_T / R_{273^{\circ}K}$ /

$R_{273^{\circ}K}$, $\delta_0 = R_0 / R_{273^{\circ}K}$, где R_0 - остаточное сопротивление образца, R_T - сопротивление при температуре опыта, $R_{273^{\circ}K}$ - при $0^{\circ}C$). Точное измерение этой величины приводит, в случае массивных образцов разумной длины, к необходимости измерять изменение сопротивления $\sim 10^{-11}$ ом.

Нами проведены исследования температурной зависимости электропроводности алюминия по методике, аналогичной описанной [5], обеспечивающей необходимую точность измерения (вольтовая чувствительность установки $10^{-11} + 5 \cdot 10^{-12}$ в).

Первые результаты излагаются в данном сообщении.

В качестве исследуемого металла был выбран алюминий, поверхность Ферми носителей тока которого либо замкнута, либо, если и открыта, то содержит узкие перемычки. Для подобных металлов температурозависимая часть электросопротивления, если таковая наблюдается, при низких температурах не может быть объяснена лишь в терминах электрон-фононных столкновений с перебросом [4].

Монокристаллические образцы различной (но достаточно высокой) чистоты можно было считать массивными. Поэтому их остаточное сопротивление связано только с рассеянием электронов на микроскопических дефектах, например примесях. Поперечный размер образцов составлял 5 ± 10 мм и был существенно больше l_{ei} (l_{ei} - длина свободного пробега электронов, обусловленная рассеянием их на примесях).

На достаточно чистых образцах в области температур ниже $4,2^{\circ}K$ (начиная с образцов, у которых $1/\delta_{4,2} = R_{273}/R_{4,2} = 3,04 \cdot 10^3$ и более) наблюдается заметное изменение электросопротивления с температурой (рис. I, а, б).

Если представить приведенное электросопротивление в виде:

$$\delta_T = \delta_0 + \delta(T) \quad (2)$$

(δ_0 - остаточное сопротивление, $\delta(T)$ - температурозависимая часть сопротивления), то для образцов различной чистоты, в соответ-

ствии с правилом Маттиссена, $\delta_T - \delta_0 = \text{const}$. Сравнение значений $\delta_T - \delta_0$ исследованных образцов при $T = 4,2^\circ\text{K}$ (рис. 2) и более низких температурах показывает, что это правило не выполняется. Расхождение велико и не может быть объяснено обычным образом [6]. Как известно, на алюминии наблюдалось отклонение подобного рода при более высоких температурах [7].

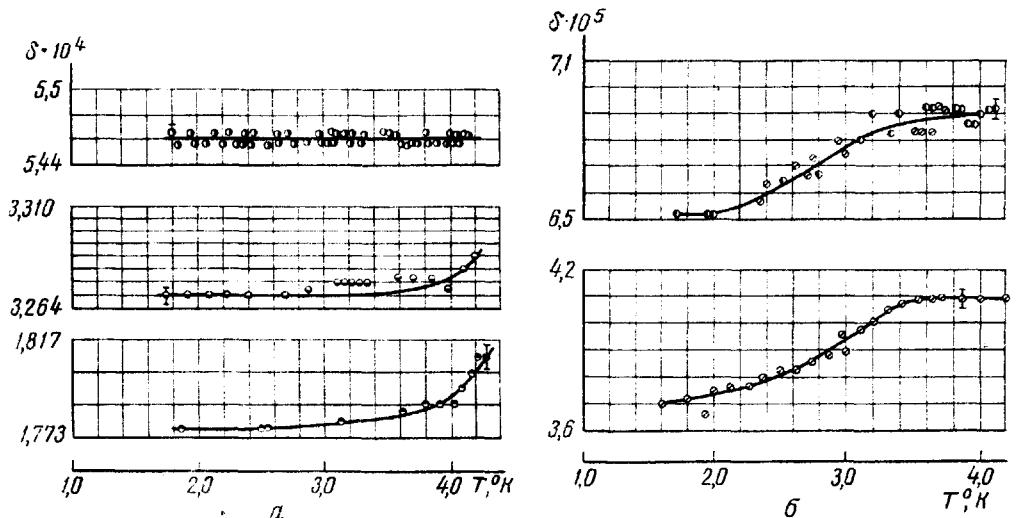


Рис. I. Температурная зависимость электросопротивления "грязных" (а) и чистых (б) образцов алюминия. а - \bullet - $I/\delta_{4,2^\circ\text{K}} = 1,83 \cdot 10^3$, точками отмечены максимальные выбросы на кривой, записанной двухкоординатным самописцем; \bigcirc - $I/\delta_{4,2^\circ\text{K}} = 3,04 \cdot 10^3$ и \square - $I/\delta_{4,2^\circ\text{K}} = 5,5 \cdot 10^3$ (измерено по точкам). б - \bullet и \bigcirc - $I/\delta_{4,2^\circ\text{K}} = 14,5 \cdot 10^3$ (измерено по точкам). Сплошная кривая соответствует также записанной на двухкоординатном самописце (выбросы не показаны); \odot - $I/\delta_{4,2^\circ\text{K}} = 24,5 \cdot 10^3$ (измерено по точкам)

Как видно из рис. I, а и б, температурный ход электросопротивления исследованных образцов в гелиевой области температур не может быть описан зависимостью (I). Из проведенного нами сравнения было получено, что экспериментальные кривые имеют иную (более высокую) степенную зависимость от T , чем (I).

Кроме того, сопоставление кривых для "грязных" (рис. I, а) и "чистых" (рис. I, б) образцов показывает, что температура, при которой достигается (с точностью до ошибки эксперимента) остаточное сопротивление, смещается в сторону низких температур с ростом чи-

стоты образцов. Относительное изменение сопротивления $(\delta_{4,2} - \delta_0)/\delta_0$ увеличивается с чистотой, достигая для самых чистых образцов $\sim 10\%$. Для последних на кривых (рис. I, б) заметно насыщение в области температур, примыкающих к $T = 4,2^{\circ}\text{K}$.

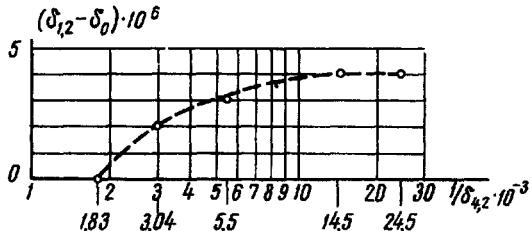


Рис. 2. Значения $\delta_\infty(T)$ при $T = 4,2^{\circ}\text{K}$, определенные для образцов разной чистоты по данным рис. I, а и б

Это, по-видимому, указывает на особенность в температурной зависимости электросопротивления алюминия. Как известно [4], подобная особенность может быть объяснена учетом нормальных (без переброса) процессов столкновений электронов и фононов в той области температур, где соответствующая длина свободного пробега ℓ_{ep}'' сравнивается с длиной свободного пробега ℓ_{ei}' , связанной с рассеянием электронов на микроскопических дефектах, ответственным за остаточное сопротивление. Очевидно, что проявление этой особенности должно быть чувствительно к чистоте металла, смещаясь в сторону низких температур для более чистых образцов, что и наблюдается на экспериментальных кривых. По порядку величины этот эффект может быть оценен следующим соотношением:

$$\frac{\ell_{ei}'}{\ell_{ei}''} \sim \left(\frac{T''_0}{T'_0} \right)^5 \quad (3)$$

(ℓ_{ei}' , ℓ_{ei}'' – электрон-примесные длины свободного пробега сравниваемых образцов различной чистоты, T'_0 , T''_0 – характерные температуры, при которых $\ell_{ep} \sim \ell_{ei}$). Исходя из этого, можно ожидать, например, что изменение чистоты образцов раз в 10 приведет к сдвигу по температуре в 1,5 раза, т.е. эффект не очень велик.

Сравнение кривых позволяет предположить, что для чистых образцов указанная особенность проявляется почти целиком в гелиевой области температур (рис. I,б), а для более "грязных" - при более высоких температурах (рис. I,а).

Зависимость электросопротивления чистых образцов от температуры (рис. I,б) удовлетворительно описывается формулами [4].

$$\delta = \delta_o [1 + \alpha (T/T_o)^5] = \delta_o + \delta(T), \quad T \ll T_o, \quad (4)$$

$$\delta' = \delta'_o [1 - \beta (T_o/T)^5] = \delta'_o - \delta'(T), \quad T \gg T_o,$$

где T_o - температура, при которой δ_{ep}^N сравнивается с δ_{ei} , δ_o - остаточное сопротивление, δ'_o - сопротивление, не зависящее от температуры в некоторой области $T \gg T_o$ ($\delta_o < \delta'_o$); $\alpha, \beta \sim 0,1$.

Это видно, например, из сравнения величин температурного интервала особенности $\Delta T = T_1 - T_2$ (T_1, T_2 - границы интервала, $T_1 > T_2$), получаемых по формулам (4) и экспериментально (рис. I,б). Сравнение, очевидно, необходимо вести так, чтобы выполнялось

$$\delta'(T_{1\vartheta})/\delta(T_o) = \delta(T_{1p})/\delta(T_o), \quad \delta(T_{2\vartheta})/\delta(T_o) = \delta(T_{2p})/\delta(T_o)$$

($T_{1\vartheta}, T_{2\vartheta}$ - экспериментальные, T_{1p}, T_{2p} - расчетные значения температур). Ограниченнaя точность эксперимента позволяет выбрать $\delta'(T_{1\vartheta})$ и $\delta(T_{2\vartheta})$ отличающимися от $\delta(T_o)$ не более чем в 10 раз (рис. I,б). Тогда получим: $(\Delta T_p - \Delta T_\vartheta)/\Delta T_\vartheta \sim 13\%$, т.е. расхождение невелико.

Из приведенных оценок следует, что изучение зависимости указанной особенности от чистоты металла в гелиевой области температур затруднено возможностью получить необходимый диапазон по чистоте образцов, так чтобы особенность всегда оставалась в пределах этой области. Чтобы при этом оценить роль обычных механизмов рассеяния, сопровождаемых процессами переброса, требуется, очевидно, расширить температурный интервал (до $\sim 14^0\text{K}$), что и будет в дальнейшем сделано. Это необходимо и для выяснения возможности наблюдения другой интересной особенности - минимума сопротивления, который должен наблюдаваться на тонких образцах [4].

В заключение благодарим Б.И.Веркина за постоянный интерес к работе, Р.Н.Гуржи за ценные обсуждения результатов измерений и О.Г.Шевченко за помощь в проведении экспериментов.

Физико-технический институт

низких температур

Поступило в редакцию

Академии наук Украинской ССР

5 апреля 1966 г.

Литература

- [1] Р.Пайерлс. Квантовая теория твердых тел, М., 1956.
- [2] Б.Н.Александров, И.Г.Дьяков. ЖЭТФ, 43, 852, 1962.
- [3] Б.Н.Александров. Диссертация, Харьков, ФТИ НТ АН УССР, 1964.
- [4] Р.Н.Гуржи. ЖЭТФ, 47, 1415, 1964.
- [5] De Vroomen, C.Van Baarle. Physica, 23, N8, 1957.
- [6] Физика низких температур, под ред. А.И.Шальникова. М., Изд. иностр. лит., 1959.
- [7] Е.С.Боровик, В.Г.Волоцкая, Н.Я.Фогель. ЖЭТФ, 45, 46, 1963.